# 用X射线实验仪验证康普顿效应

许宏炜

**摘 要**:本实验证明 LEYBOLD Physics Leaflets 中提供的测量方法的错误,通过给定两个假设,设计了适用于波长任意分布的复色 X 光验证康普顿效应的方法,利用数值计算求得康普顿散射波长位移 $\Delta\lambda$ 。

**关键词:** X 射线:康普顿效应:数值计算

#### 1 引言

1922年,康普顿用单个光子和自由电子的简单碰撞理论,根据能量动量守恒,考虑相对论效应,得到 X 射线被电子散射前后的波长随散射角的变化满足

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$

式中h为普朗克常量,c为光速, $\theta$ 为散射后的光子与入射光子传播方向的夹角, $\lambda_1$ 和 $\lambda_2$ 分别为散射前后 X 射线的波长。 $m_0$ 为电子质量, $\frac{h}{m_0c}=2.43$ pm,称为康普顿波长。本实验利用 X 射线实验仪,测量特定散射角 $\theta$ 下 X 射线与靶材料中的电子相互作用发生非相干散射后波长的变化 $\lambda_2-\lambda_1$ 。

#### 2 实验设计

实验所用仪器是德国莱宝公司生产的 X 射线实验仪,该仪器能够探测不同 $\theta$ 方向上 X 光的光强,但无法直接测量波长或波长差。

一种间接测量方法 <sup>1</sup>是利用Cu箔对不同波长 $\lambda$ 的透射率T的关系T  $\sim \lambda$  ,将波长的测量转化为透射率的测量。已知铜箔对X光的透射率满足经验公式 $T_{Cu}=e^{-a(\frac{\lambda}{100\mathrm{pm}})^n}$ ,a和n为常系数,与Cu箔厚度有关。通过逆变换得到反函数 $\lambda=f(T)$ 。

如图 1 所示,测量不放 Cu 箔时的计数率 $R_0$ 以及 Cu 箔分别固定在 X 光出射口及传感器前的计数率 $R_1$ 及 $R_2$ 。因强度较低,还需测量不放 Cu 箔及 Cu 固定在传感器前时环境辐射的计数率R'和 $R''^2$ 。记未经康普顿散射和经康普顿散射的 X 光对 Cu 箔的透射率分别为 $T_1$ 和 $T_2$ ,则有

$$T_1 = \frac{R_1 - R'}{R_0 - R'}$$
  $T_2 = \frac{R_2 - R''}{R_0 - R'}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>参考 LEYBOLD Physics Leaflets

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> LEYBOLD Physics Leaflets 中只测量R',笔者认为将 Cu 箔固定在传感器口已经改变了传感器测量环境,需再单独测量R''。

$$\Delta \lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = f(T_2) - f(T_1)$$

此方法要求出射的 X 光为单色光,而实验所用 X 射线仪通过轰击钼靶产生的 X 光波长连续分布,加入 Zr 滤波片可以过滤 $K_{\beta}$ 线,但无法消除轫致辐射。所以产生的 X 光单色性较差,不适合使用该方法。笔者通过给定两个假设,通过数值计算的方法,可直接求得波长连续分布的 X 光经康普顿散射后波长整体的平移 $\Delta\lambda$ ,不再要求所用 X 光必须是单色光。

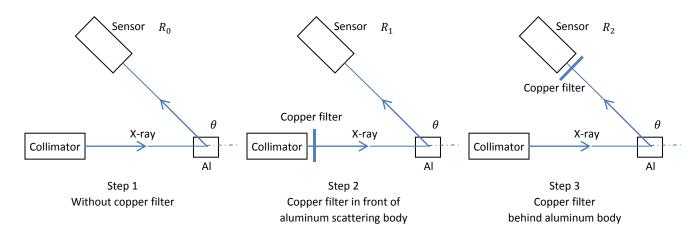


图 1 用 X 射线仪验证康普顿效应实验步

# 假设 1: 任意波长的 X 光通过介质时发生康普顿散射的平均概率相同假设 2: GM 计数器对不同波长 X 光强度的计数可以线性叠加

由康普顿散射公式可知,经散射后,波长整体平移 $\Delta\lambda$ 。再结合假设 1 可推得,光强分布为  $r(\lambda)$ 的 X 光经康普顿散射后在 $\theta$ 散射角上的光强分布为  $r(\lambda - \Delta\lambda) \cdot P(\theta)$ , $P(\theta)$ 为光子被散射到 $\theta$ 角的概率,与 $\lambda$ 无关。

基于假设2可定义复色光有效透射率

$$T_{eff} = \frac{\int r'(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda}{\int r(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda}$$

其中 $r(\lambda)$ 、 $r'(\lambda)$ 分别为经过介质前后光强随 $\lambda$ 的密度分布。则 $T_1$ 和 $T_2$ 的有效透射率表达式为

$$T_{1,eff} = \frac{\int r(\lambda) \cdot T(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda}{\int r(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda}$$

$$T_{2,eff} = \frac{\int r(\lambda - \Delta \lambda) \cdot P(\theta) \cdot T(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda}{\int r(\lambda - \Delta \lambda) \cdot P(\theta) \, \mathrm{d}\lambda} = \frac{\int r(\lambda - \Delta \lambda) \cdot T(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda}{\int r(\lambda - \Delta \lambda) \, \mathrm{d}\lambda}$$

若已知 $r(\lambda)$ 及 $T(\lambda)$ ,则可通过数值计算得出 $T_{2,eff}$ ~ $\Delta\lambda$ 曲线。因此,只要测出 $T_{2,eff}$ ,就能读数得到 $\Delta\lambda$ 。

# 3 实验方法及实验结果

#### 1. 测量 Cu 箔对 X 光的透射率 $T(\lambda)$

设置U=30.0kV,I=1.00mA, $\Delta t=30$ s, $\beta=3.5^{\circ}\sim8.3^{\circ}$ , $\Delta\beta=0.1^{\circ}$ ,分别测量不放 Cu 箔与固定 Cu 箔在 X 光出射口两种情况的 X 光 NaCl 晶体衍射谱,两组数据相除得到实验值 $T_{\rm s}(\lambda)$ ,根据经验公式拟合,得到系数a和n。

如图 2 所示,实验值 $T(\lambda)$ 在 $\lambda = 70~80$ pm内发生异常,这是因为此处包含了 $\lambda \cong 35~40$ pm经过布拉格二级衍射被传感器接受的贡献,已经不再满足单色光条件。故在拟合时予以舍去。经过拟合,得 $\alpha = 6.58$ ,n = 2.698。则

$$T_{Cu}(\lambda) = e^{-6.58(\frac{\lambda}{100 \text{pm}})^{2.698}}$$

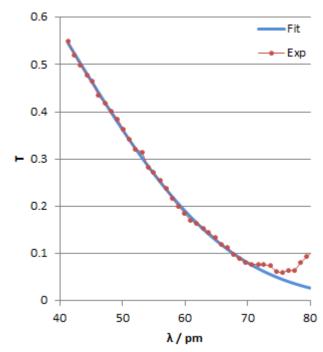


图 2 Cu 箔对 X 光的透射率 $T(\lambda)$ 的实验值与拟合曲

#### 2. X 光管产生的 X 光经 Zr 滤波片后的光强密度分布 $r(\lambda)$

设置U=30.0kV,I=1.00mA, $\Delta t=10$ s, $\beta=3.0^\circ \sim 8.0^\circ$ , $\Delta \beta=0.1^\circ$ ,测量 X 光的 NaCl 晶体衍射谱。测量结果如图 3 所示,该计数率分布等效于光强密度分布 $r(\lambda)$ 。进而根据 $T_{2,eff}$ 的公式,通过数值计算得到 $T_{2,eff} \sim \Delta \lambda$ 曲线,如图 4 所示。

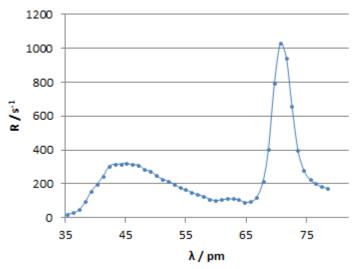


图 3 X 光管产生的 X 光经 Zr 滤波片后的光强计数率分布

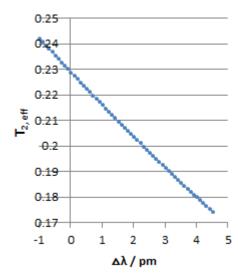


图 4  $T_{2,eff}$ 随 $\Delta\lambda$ 的变化曲

3. 测量145°散射角下的 $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、R'、R''

在 X 光出射口固定 Zr 滤光片,靶台上放置铝块。调节 SENSOR: 145°,TARGET: 20°。 设定U=30.0kV,I=1.00mA,  $\Delta\beta=0.0$ °。如图所示,分三步测量 $R_0$ 、 $R_1$ 、 $R_2$ 、R'、R''。

- a. 不放 Cu 箔
  - I.  $\Delta t = 60$ s,测得 $R_0 = 7.00$  s<sup>-1</sup>
  - II.  $\Delta t = 600$ s,设置I = 0.00mA,测量环境辐射的影响R' = 0.354 s<sup>-1</sup>
- b. X 光出射口固定 Cu 箔
  - I.  $\Delta t = 600$ s,测量 $R_1 = 1.886$  s<sup>-1</sup>
- c. SENSOR 入口固定 Cu 箔
  - I.  $\Delta t = 600$ s,测量 $R_2 = 1.549$  s<sup>-1</sup>
  - II.  $\Delta t = 600$ s,设置I = 0.00mA,测量环境辐射的影响R'' = 0.268 s<sup>-1</sup>

#### 4. 计算Δλ并与理论值比较

计算 $T_1$ 和 $T_2$ ,按照第一种方法计算Δλ,结果如下:

表 1 单色光入射时145°散射角下康普顿散射的波长位移

$\overline{T_1}$	$T_2$	$\lambda_1$ / pm	$\lambda_2$ / pm	Δλ / pm	$\Delta \lambda_{theory}$ / pm	differ
0.2305	0.1927	57.34	59.84	2.50	4.42	43%

按照第二种方法,从图 4 中读得数据,结果如下:

表 2 复色光入射时145°散射角下康普顿散射的波长位移

$T_1$	$T_2$	Δλ / pm	$\Delta \lambda_{theory}$ / pm	differ
0.2305	0.1927	2.92	4.42	34%

#### 4 分析与讨论

图 3 直观地反映了经 Zr 箔过滤的 X 光虽然有较高的 $K_{\alpha}$ 主峰,但是轫致辐射分布很广,面积与主峰相当。表 1 中由透射率 $T_1$ 计算得到的入射光波长 $\lambda_1=57.34$  pm,但 $\lambda_{K_{\alpha}}=71.1$  pm,这一结果与该方法的前提"入射光必须是单色光"相矛盾,证明这一方法是错误的。

第二种方法采用数值计算读数的方式直接读出 $\Delta\lambda$ 。当 $\Delta\lambda$  = 0时,从图 4 中读得 $T_{2,eff}$  = 0.2291。理论上该值应等于 $T_1$ ,对比表 2 中数据,相对误差仅为0.6%。但是测得的 $\Delta\lambda$ 仍有34%的误差,可能来源于以下几个原因:

- 1. 假设1或假设2不成立。
- 2. 光强计数率只统计了35.4°~78.5°这一区间,而 $T_{2,eff}$ 的计算是要对 $\lambda$ 全范围进行积分,这一简化导致图 4 的结果产生偏差。
- 3. 实验所用 X 光波长大约在30pm~80pm之间,与康普顿散射波长位移 $\Delta\lambda$ 相比较大,对波长1%的测量误差,将放大 10 多倍体现在 $\Delta\lambda$ 的误差上。

### 5 实验总结

本实验测量了 X 光管产生的 X 光经 Zr 滤波片后的光强密度随波长 $\lambda$ 的分布,数据证明其并非理想的单色光,从而证明 LEYBOLD Physics Leaflets 中提供的测量方法在该实验环境下是错误的。 笔者通过给定两个假设,利用数值计算的方法直接求得康普顿散射波长位移 $\Delta\lambda$ ,该方法适用于波长任意分布的复色 X 光。

因为本实验测量的数据组数较少,两个假设也尚未进行实验验证,第二种数值方法仅是一个方向,需要更多的工作来验证、完善这一思路。

#### 致谢

感谢搭档李小龙的帮助与讨论, 以及实验中心俞熹老师的指导。

# 参考文献

- [1] LEYBOLD Physics Leaflets, Compton Effect.
- [2] 张艳席等. 用 X 射线衍射验证康普顿效应的实验研究. 物理实验, 2007:45~48
- [3] 沈元华, 陆申龙. 基础物理实验. 北京: 高等教育出版社, 2003, 343~351